

# 物理特性の変更が可能な RO-PUF

川述 優<sup>†</sup> 町田 卓謙<sup>††</sup> 崎山 一男<sup>††</sup>

† 電気通信大学 電気通信学部 †† 電気通信大学 大学院情報理工学研究科

## 1. はじめに

近年、セキュリティ技術として PUF(Physically Unclonable Function)の研究が行われている。PUF とは、製造ばらつきが複製・再現困難であることを利用し、物理的に複製困難な ID の生成を行う技術である。

しかし、既存 PUF では出力が所望のばらつきを示さない場合、PUF 回路の再設計を行う必要があった。そこで本研究は PUF の一種である RO(Ring Oscillator)-PUF [1] に対し、設計後に回路の一部分を変更可能な構成を設けることで、出力を変化させることが容易な RO-PUF の実現を目標とした。

## 2. 関連研究

RO は論理素子のインバータを奇数個リング状に接続した発振回路である。同設計の複数の RO を用意したとき、各 RO は実際に使用している配線、素子が異なることから、配線遅延、素子遅延が異なる。そのため発振周波数が異なる。RO-PUF は、任意の 2 つの RO の発振周波数の高低を比較することで、0 or 1 を出力する[2]。

## 3. 本研究で提案する RO-PUF

本研究で提案する RO-PUF(以下、提案 RO-PUF)の構成を図 1 に示す。発振周波数のばらつきは素子や配線の物理特性に依存している。そのため既存の RO-PUF では出力を変化させる際、LSI 内の利用するインバータの個数や配置の変更が必要である。

提案 RO-PUF では、発振周波数のばらつきを LSI 内の素子や配線だけではなく、ボード上の配線やジャンパーにも依存させることで、出力を変化させることを容易にした。

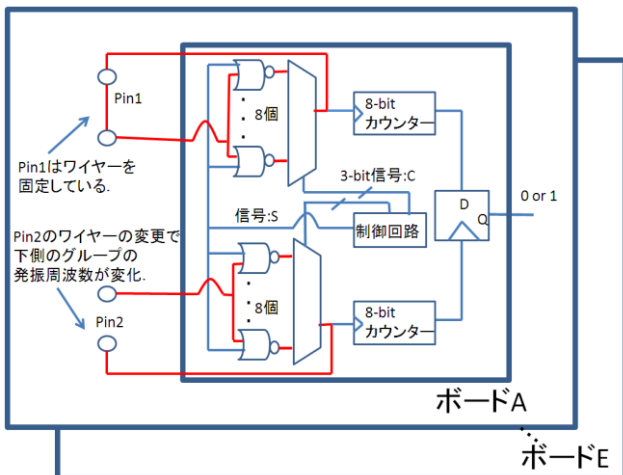


図 1: 提案する RO-PUF の構成

## 4. 実験方法

8 個の RO を 1 組とし、2 組の RO の組を FPGA 上に実装した。各組から 1 つずつ RO を選び、全 64 通りの比較を行い、64-bit の出力を得た。この実験をジャンパーとして選んだ 5 本のワイヤーに対して行った。なお、ボードは A~E の 5 枚を用いた。

## 5. 実験結果

表 1 にボード A でワイヤー 1~5 を用いて得られた出力を示す。また、出力は 16 進数表記で示している。

表 1: ボード A でワイヤー 1~5 を用いた時の各出力

ワイヤー	64-bit の出力							
1	3 8	3 A	1 8	3 8	3 8	3 A	3 8	3 8
2	3 A	3 A	3 8	3 A	3 A	B B	3 A	3 A
3	3 A	3 A	3 8	3 A	3 A	B A	3 A	3 A
4	B A	B B	3 A	B A	3 A	B F	B F	B A
5	3 A	B A	3 8	3 A	3 A	B F	B A	B A

表 1 から、ワイヤーの変更で出力が変化していることが判る。出力間の最大 HD は 18-bit、最低 HD は 1-bit、平均 HD は 8-bit である。

しかし、ワイヤーの変更で出力が変化しないビットも確認出来る。また、ボード B~E でも同じ様な傾向の結果が得られたことから、設計に改善の余地があることが判る。

## 7. まとめ

セキュリティ技術の一つである PUF では、出力の変更には再設計が必要という問題点がある。これに対し、設計後に回路構成を変更可能とすることで、出力を変化させることが可能な RO-PUF の実現を目標とした研究であった。結果としてワイヤーの変更が出力を変化させていることが判った。しかし、変化を示さないビットも各ボードで確認できたことから、改善の余地があることが判った。今後の課題として、再現性の評価、出力のばらつき向上に向けた考察が挙げられる。

## 参考文献

- [1] Blaise Gassend, Dwaine E. Clarke, Marten van Dijk, Srinivas Devadas, "Silicon Physical Random Functions," In ACM Conference on Computer and Communications Security-CCS 2002, pp.148-160, 2002.
- [2] G. Edward Suh, Srinivas Devadas, "Physical Unclonable Functions for Device Authentication and Secret Key Generation," In Proceedings of the 44<sup>th</sup> annual Design Automation Conference, DAC'07, pp.9-14, 2007.